

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△	1	RE-F-09600	中村	山口	04.03.22	△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲		-55℃～85℃(注1)			保存温度範囲		-10℃～60℃(注2)			
	電圧		AC 125V			使用湿度範囲		40%～80%			
	電流		0.5A			保存湿度範囲		40%～70%(注2)			
性能											
	項目		試験方法			規格			QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○	
	表示		目視にて確認する。						○	○	
電気的 性能	接触抵抗		100mA(DC又は1000Hz)で測定する。			30mΩ以下			○	—	
	低電圧、低電流下の 接触抵抗		20mV以下、1mA(DCまたは1000Hz)で 測定する。			30mΩ以下			○	—	
	絶縁抵抗		DC 250Vで測定する。			1000MΩ以上			○	—	
機械的 性能	耐電圧		AC 300Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—	
	繰り返し動作		500回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 30mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	耐振性		周波数 10～55Hz、全振幅 1.5mm、 3方向各 2時間試験する。			① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
環境的 性能	耐衝撃性		加速度 490m/s ² 、持続時間 11ms、 正弦半波 3方向各 3回試験する。						○	—	
	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96時間放置する。			① 接触抵抗: 30mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	温度サイクル		温度 -65→+15→+35→+125→+15→+35℃ 時間 30→MAX 5→30→MAX 5分 を 5サイクル試験する。△						○	—	
	塩水噴霧		濃度 5%の塩水、48時間放置する。			① 接触抵抗: 30mΩ以下			○	—	
	硫化水素		濃度 3ppm、120時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。			○	—	
	はんだ耐熱性		はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間 はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5秒以内			外観の変形及び端子などに著しい ガタのないこと。			○	—	
はんだ付け性		はんだ温度 245±3℃、浸せき時間 2秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。			○	—		
備考											
注1. 通電時の温度上昇を含みます。						製図		担当	検図	承認	出図
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。						HIF 04.02.16 中村		HIF 04.02.16 中村	HIF 04.02.16 山口	HIF 04.02.16 大川	
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 HIF6A-**PA-1.27DS(71)		
旧CL CL			図番 SLC4-082797-21			製品コード CL631			1 1		

